

(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 特 許 公 報 (B2)

(11) 特許番号

特許第6039088号
(P6039088)

(45) 発行日 平成28年12月7日 (2016. 12. 7)

(24) 登録日 平成28年11月11日 (2016. 11. 11)

(51) Int. Cl.	F 1
GO 1 P 5/26 (2006. 01)	GO 1 P 5/26 A
GO 1 F 1/66 (2006. 01)	GO 1 F 1/66 1 O 3

請求項の数 12 (全 21 頁)

(21) 出願番号	特願2015-535262 (P2015-535262)	(73) 特許権者	000005016
(86) (22) 出願日	平成25年9月9日 (2013. 9. 9)		パイオニア株式会社
(86) 国際出願番号	PCT/JP2013/074244		東京都文京区本駒込二丁目28番8号
(87) 国際公開番号	W02015/033469	(74) 代理人	100104765
(87) 国際公開日	平成27年3月12日 (2015. 3. 12)		弁理士 江上 達夫
審査請求日	平成28年2月26日 (2016. 2. 26)	(74) 代理人	100107331
			弁理士 中村 聡延
		(72) 発明者	立石 潔
			神奈川県川崎市幸区新小倉1番1号 パイオニア株式会社内
		審査官	山下 雅人

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 流速検出装置及び流速検出方法

(57) 【特許請求の範囲】

【請求項 1】

流路及び該流路を流れる流体に計測光を照射する照射手段と、
 前記流路によって散乱された前記計測光と、前記流体によって散乱された前記計測光との干渉光を受光する受光手段と、
 前記流体の速度に関する情報の指定値を取得する取得手段と、
 前記指定値に基づいて決定された利用周波数範囲における前記干渉光を示す信号を演算して、前記流体の速度に関する情報を出力する出力手段と
 を備えることを特徴とする流速検出装置。

【請求項 2】

前記流路に前記流体を流す動作を、前記指定値に応じて実行する駆動手段を更に備えることを特徴とする請求項 1 に記載の流速検出装置。

【請求項 3】

前記取得手段は、前記駆動手段の駆動量から前記指定値を演算して取得することを特徴とする請求項 2 に記載の流速検出装置。

【請求項 4】

前記駆動手段は、回転ポンプ及び該回転ポンプの回転数を検出する回転数検出手段を有し、

前記取得手段は、前記回転数検出手段が検出した回転数に基づいて、前記指定値を演算する

10

20

ことを特徴とする請求項 3 に記載の流速検出装置。

【請求項 5】

流路及び該流路を流れる流体に計測光を照射する照射手段と、
前記流路によって散乱された前記計測光と、前記流体によって散乱された前記計測光との干渉光を受光する受光手段と、
前記干渉光を示す信号のスペクトルの周波数に対する傾きが、所定の閾値となる周波数までを、前記干渉光を示す信号の利用周波数範囲として決定する決定手段と、
前記干渉光を示す信号の前記利用周波数範囲を演算して、前記流体の速度に関する情報を出力する出力手段と
を備えることを特徴とする流速検出装置。

10

【請求項 6】

前記出力手段は、前記干渉光を示す信号に対して高速フーリエ変換を行う FFT 手段を有することを特徴とする請求項 1 又は 5 に記載の流速検出装置。

【請求項 7】

前記出力手段は、前記干渉光を示す信号の前記利用周波数範囲のみを通過させるフィルタ手段を有することを特徴とする請求項 1 又は 5 に記載の流速検出装置。

【請求項 8】

前記出力手段は、前記干渉光を示す信号を A/D 変換する A/D 変換手段、及び該 A/D 変換手段のサンプリングクロックを発生させるクロック生成手段を有し、
前記クロック生成手段は、前記利用周波数範囲に応じて、前記サンプリングクロックの周波数を変更する
ことを特徴とする請求項 1 又は 5 に記載の流速検出装置。

20

【請求項 9】

前記受光手段は、複数の受光素子を含んで構成されており、該複数の受光素子の各々の検出電流を減算して前記干渉光を示す信号として出力することを特徴とする請求項 1 又は 5 に記載の流速検出装置。

【請求項 10】

前記流路は、交換可能な透明チューブであることを特徴とする請求項 1 又は 5 に記載の流速検出装置。

【請求項 11】

30

流路及び該流路を流れる流体に計測光を照射する照射工程と、
前記流路によって散乱された前記計測光と、前記流体によって散乱された前記計測光との干渉光を受光する受光工程と、
前記流体の速度に関する情報の指定値を取得する取得工程と、
前記指定値に基づいて決定された利用周波数範囲における前記干渉光を示す信号を演算して、前記流体の速度に関する情報を出力する出力工程と
を含むことを特徴とする流速検出方法。

【請求項 12】

流路及び該流路を流れる流体に計測光を照射する照射工程と、
前記流路によって散乱された前記計測光と、前記流体によって散乱された前記計測光との干渉光を受光する受光工程と、
前記干渉光を示す信号のスペクトルの傾きが、所定の閾値となる周波数までを、前記干渉光を示す信号の利用周波数範囲として決定する決定工程と、
前記干渉光を示す信号の前記利用周波数範囲を演算して、前記流体の速度に関する情報を出力する出力工程と
を含むことを特徴とする流速検出方法。

40

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、光を照射することで流路内の流体の速度を検出する流速検出装置及び流速検

50

出方法の技術分野に関する。

【背景技術】

【0002】

この種の装置として、例えばドップラシフトを利用して流体の速度を検出する装置が知られている。例えば特許文献1では、流体からのドップラシフト光をレーザ共振器の中で共振させるという技術が提案されている。また特許文献2では、水中の超音波ドップラ計測器において、重心計算区間の周波数範囲を繰り返し補正するという技術が提案されている。更に特許文献3では、ドップラ周波数スペクトルから、最大周波数と最小周波数とを計算する技術が提案されている。

【先行技術文献】

10

【特許文献】

【0003】

【特許文献1】特表2012-520720号公報

【特許文献2】特開2007-292668号公報

【特許文献3】特表2010-522581号公報

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

【0004】

上述したドップラシフトを利用した流速検出においては、例えばドップラシフトが生じた光の干渉光に関する光強度信号が用いられる。具体的には、干渉光の光強度信号のパワースペクトルを利用した演算を行うことで、流体の速度が検出される。

20

【0005】

ここで特に、本願発明者の研究するところによれば、光強度信号のパワースペクトルは、流体の速度によって集中する周波数帯域が異なることが判明している。具体的には、低流速時の光強度信号のパワースペクトルは低い周波数に集中し、高流速時の光強度信号のパワースペクトルは高い周波数に集中する。

【0006】

一方で、光強度信号のパワースペクトルは、流速に依存しないノイズの影響を少なからず受ける。このため、検出しようとする流速が異なる場合、各周波数のパワースペクトルに対するノイズの影響に違いが発生する。よって、流速によらず常に同一の演算方法を利用しようとすると、正確な流速を検出できないという技術的問題点が発生する。

30

【0007】

本発明が解決しようとする課題には、上記のようなものが一例として挙げられる。本発明は、検出しようとする流速に応じた周波数帯域の演算により、流体の速度に関する情報を好適に検出可能な流速検出装置及び流速検出方法を提供することを課題とする。

【課題を解決するための手段】

【0008】

上記課題を解決するための第1の流速検出装置は、流路及び該流路を流れる流体に計測光を照射する照射手段と、前記流路によって散乱された前記計測光と、前記流体によって散乱された前記計測光との干渉光を受光する受光手段と、前記流体の速度に関する情報の指定値を取得する取得手段と、前記指定値に基づいて決定された利用周波数範囲における前記干渉光を示す信号を演算して、前記流体の速度に関する情報を出力する出力手段とを備える。

40

【0009】

上記課題を解決するための第2の流速検出装置は、流路及び該流路を流れる流体に計測光を照射する照射手段と、前記流路によって散乱された前記計測光と、前記流体によって散乱された前記計測光との干渉光を受光する受光手段と、前記干渉光を示す信号のスペクトルの周波数に対する傾きが、所定の閾値となる周波数までを、前記干渉光を示す信号の利用周波数範囲として決定する決定手段と、前記干渉光を示す信号の前記利用周波数範囲を演算して、前記流体の速度に関する情報を出力する出力手段とを備える。

50

【0010】

上記課題を解決するための第1の流速検出方法は、流路及び該流路を流れる流体に計測光を照射する照射工程と、前記流路によって散乱された前記計測光と、前記流体によって散乱された前記計測光との干渉光を受光する受光工程と、前記流体の速度に関する情報の指定値を取得する取得工程と、前記指定値に基づいて決定された利用周波数範囲における前記干渉光を示す信号を演算して、前記流体の速度に関する情報を出力する出力工程とを含む。

【0011】

上記課題を解決するための第2の流速検出方法は、流路及び該流路を流れる流体に計測光を照射する照射工程と、前記流路によって散乱された前記計測光と、前記流体によって散乱された前記計測光との干渉光を受光する受光工程と、前記干渉光を示す信号のスペクトルの傾きが、所定の閾値となる周波数までを、前記干渉光を示す信号の利用周波数範囲として決定する決定工程と、前記干渉光を示す信号の前記利用周波数範囲を演算して、前記流体の速度に関する情報を出力する出力工程とを含む。

【図面の簡単な説明】

【0012】

【図1】第1実施例に係る流速検出装置の全体構成を示すブロック図である。

【図2】第1実施例に係る受光素子及び増幅器の構成を示すブロック図である。

【図3】第1実施例に係る信号処理部の構成を示すブロック図である。

【図4】低流速時及び高流速時における光強度信号のパワーと周波数との関係を示すグラフ（その1）である。

【図5】第1実施例に係る信号処理部の動作を示すフローチャートである。

【図6】第2実施例に係る信号処理部の構成を示すブロック図である。

【図7】低流速時及び高流速時における光強度信号のパワーと周波数との関係を示すグラフ（その2）である。

【図8】第1BPF及び第2BPFのゲインと周波数との関係を示すグラフである。

【図9】第3実施例に係る流速検出装置の全体構成を示すブロック図である。

【図10】第4実施例に係る信号処理部の動作を示すフローチャートである。

【図11】低流速時及び高流速時における光強度信号のパワーと周波数との関係を示すグラフ（その3）である。

【発明を実施するための形態】

【0013】

本実施形態に係る第1の流速検出装置は、流路及び該流路を流れる流体に計測光を照射する照射手段と、前記流路によって散乱された前記計測光と、前記流体によって散乱された前記計測光との干渉光を受光する受光手段と、前記流体の速度に関する情報の指定値を取得する取得手段と、前記指定値に基づいて、前記干渉光を示す信号の利用周波数範囲を決定する決定手段と、前記干渉光を示す信号の前記利用周波数範囲を演算して、前記流体の速度に関する情報を出力する出力手段とを備える。

【0014】

本実施形態に係る第1の流速検出装置によれば、その動作時には、例えば透明チューブ等として構成される流路を流れる流体に対して、照射手段から計測光が照射される。照射手段は、例えば発光ダイオードを含んで構成されており、その使用時には、流路及び流体に効率的に計測光を照射できる位置に配置される。

【0015】

照射手段から照射された計測光は流路及び流体において夫々散乱される。そして受光手段では、流路において散乱された計測光と、流体において散乱された計測光との干渉光を受光される。受光手段は、例えばフォトダイオード等を含んで構成され、その使用時には、例えば流路及び流体から見て照射手段とは反対側の位置に配置される。

【0016】

受光手段で干渉光を受光される一方で、取得手段では、流体の速度に関する情報の指定

10

20

30

40

50

値が取得される。なお、ここでの「流体の速度に関する情報」とは、流体の速度の値そのものに加えて、流体の速度を利用して求められる各種情報（例えば、流量等）を含む広い概念である。また、「指定値」とは、流体の速度の基準として設定される値であり、例えば外部から入力される流速指令等に対応する値である。

【0017】

指定値が取得されると、決定手段では、取得された指定値に基づいて、干渉光を示す信号の利用周波数範囲が決定される。なお、「利用周波数範囲」とは、後述する出力手段の演算に利用される周波数の範囲を定めるものであり、取得される指定値の大小に応じて決定される。例えば、利用周波数範囲は指定値が大きいほど広い範囲として決定される。

【0018】

利用周波数範囲が決定されると、出力手段では、干渉光を示す信号の利用周波数範囲が演算され、流体の速度に関する情報が出力される。即ち、出力手段は、受光手段から得られた干渉光を示す信号について、利用周波数範囲内の情報のみを用いて流体の速度に関する情報を演算する。言い換えれば、利用周波数範囲外の情報については、除外された状態で流体の速度に関する情報が演算される。

【0019】

ここで特に、本願発明者の研究するところによれば、干渉光を示す信号のパワースペクトルは、流体の速度によって集中する周波数帯域が異なることが判明している。具体的には、低流速時の干渉光を示す信号のパワースペクトルは低い周波数に集中し、高流速時の干渉光を示す信号のパワースペクトルは高い周波数に集中する。

【0020】

一方で、干渉光を示す信号のパワースペクトルは、流速に依存しないノイズの影響を少なからず受ける。このため、検出しようとする流速が異なる場合、各周波数のパワースペクトルに対するノイズの影響に違いが発生する。よって仮に、流速によらず常に同一の演算方法を利用しようとすると、正確な流速を検出できないおそれがある。

【0021】

しかるに本実施形態では、上述したように、流体の速度に関する情報の指定値（言い換えれば、検出しようとしている流体の速度に関する情報のおおよその推定値）に基づいて、干渉光を示す信号の利用周波数範囲が決定される。このため、ノイズの影響を考慮した適切な周波数範囲を利用して、流体の速度に関する情報を演算できる。

【0022】

以上説明したように、本実施形態に係る第1の流速検出装置によれば、高い精度で流体の速度に関する情報を検出することが可能である。

【0023】

本実施形態に係る第1の流速検出装置の一態様では、前記流路に前記流体を流す動作を、前記指定値に応じて実行する駆動手段を更に備える。

【0024】

この態様によれば、例えば回転ポンプ等として構成される駆動手段が指定値に応じて動作し、その結果として流路に流体が流れる。このため、取得された指定値に基づいて利用周波数範囲を決定すれば、適切な周波数範囲で流体の速度に関する情報を演算できる。

【0025】

上述した駆動手段を備える態様では、前記取得手段は、前記駆動手段の駆動量から前記指定値を演算して取得してもよい。

【0026】

この場合、指定値が駆動手段の駆動量から演算されるため、指定値を直接取得する場合と比べて、より適切な指定値を取得できる。即ち、実際に駆動手段において実現されている駆動量に応じて指定値が演算されるため、利用周波数範囲を決定するのに適切な指定値を取得できる。これにより、指定値から推定される駆動量と、実際の駆動量に差が生じている場合であっても、好適に利用周波数範囲を決定できる。

【0027】

上述した駆動手段の駆動量から指定値を取得する態様では、前記駆動手段は、回転ポンプ及び該回転ポンプの回転数を検出する回転数検出手段を有し、前記取得手段は、前記回転数検出手段が検出した回転数に基づいて、前記指定値を演算してもよい。

【0028】

この場合、回転ポンプの回転数が、指定値を演算するために用いられる駆動手段の駆動量として検出される。このように構成すれば、駆動手段の駆動量を、比較的容易な構成で、且つ高い精度で検出できる。従って、より好適に指定値を演算することができ、適切な利用周波数範囲を決定できる。

【0029】

本実施形態に係る第2の流速検出装置は、流路及び該流路を流れる流体に計測光を照射する照射手段と、前記流路によって散乱された前記計測光と、前記流体によって散乱された前記計測光との干渉光を受光する受光手段と、前記干渉光を示す信号のスペクトルの周波数に対する傾きが、所定の閾値となる周波数までを、前記干渉光を示す信号の利用周波数範囲として決定する第2の決定手段と、前記干渉光を示す信号の前記利用周波数範囲を演算して、前記流体の速度に関する情報を出力する出力手段とを備える。

10

【0030】

本実施形態に係る第2の流速検出装置によれば、その動作時には、例えば透明チューブ等として構成される流路を流れる流体に対して、照射手段から計測光が照射される。照射手段は、例えば発光ダイオードを含んで構成されており、その使用時には、流路及び流体に効率的に計測光を照射できる位置に配置される。

20

【0031】

照射手段から照射された計測光は流路及び流体において夫々散乱される。そして受光手段では、流路において散乱された計測光と、流体において散乱された計測光との干渉光を受光される。受光手段は、例えばフォトダイオード等を含んで構成され、その使用時には、例えば流路及び流体から見て照射手段とは反対側の位置に配置される。

【0032】

受光手段で干渉光を受光されると、第2の決定手段において、干渉光を示す信号のスペクトルの周波数に対する傾きが求められ、所定の閾値と比較される。なお、ここでの「所定の閾値」とは、利用周波数範囲を決定するための閾値であり、干渉光を示す信号のスペクトルに対するノイズの割合に基づいて予め理論的、実験的、或いは経験的に求められ設定されている。例えば、所定の閾値は、干渉光を示す信号に対するノイズの影響が、流体の速度に関する情報を高精度で演算できる程度に小さい、或いは流体の速度に関する情報を正確に演算できない程度に大きいかを判別できるような値として設定される。

30

【0033】

そして第2の決定手段では、干渉光を示す信号のスペクトルの傾きが所定値となる周波数までの範囲が、干渉光を示す信号の利用周波数範囲として決定される。即ち、干渉光を示す信号のスペクトルの傾きが所定値と等しくなった周波数が利用周波数の上限値として決定される。

【0034】

利用周波数範囲が決定されると、出力手段では、干渉光を示す信号の利用周波数範囲が演算され、流体の速度に関する情報が出力される。即ち、出力手段は、受光手段から得られた干渉光を示す信号について、利用周波数範囲内の情報のみを用いて流体の速度に関する情報を演算する。言い換えれば、利用周波数範囲外の情報については、除外された状態で流体の速度に関する情報が演算される。

40

【0035】

以上説明したように、本実施形態に係る第2の流速検出装置によれば、干渉光を示す信号から利用周波数範囲が決定され、流体の速度に関する情報が演算される。よって、例えば流速指令のような指定値を取得できない場合であっても、ノイズの影響を考慮した適切な周波数範囲を利用して、流体の速度に関する情報を演算できる。従って、高い精度で流体の速度に関する情報を検出することが可能である。

50

【0036】

本実施形態に係る流速検出装置の他の態様では、前記出力手段は、前記干渉光を示す信号に対して高速フーリエ変換を行うFFT手段を有する。

【0037】

この態様によれば、干渉光を示す信号に対して高速フーリエ変換（FFT：Fast Fourier Transform）を実行することができるため、干渉光を示す信号を用いて、好適に流体の速度に関する情報を演算できる。なおFFT手段は、受光手段から出力される干渉光を示す信号に対してA/D変換を実行するA/D変換手段を有していてもよい。

【0038】

本実施形態に係る流速検出装置の他の態様では、前記出力手段は、前記干渉光を示す信号の前記利用周波数範囲のみを通過させるフィルタ手段を有する。

10

【0039】

この態様によれば、フィルタ手段により、干渉光を示す信号のうち利用周波数範囲外のものがカットされる。従って、干渉光を示す信号の利用周波数範囲での演算を好適に実行できる。

【0040】

なお、フィルタ手段は、利用周波数範囲に応じてフィルタのゲインが可変とされている。或いは、異なるゲインの複数のフィルタ手段が用意され、その中から利用周波数範囲に応じたフィルタが選択されるようにしてもよい。

20

【0041】

本実施形態に係る流速検出装置の他の態様では、前記出力手段は、前記干渉光を示す信号をA/D変換するA/D変換手段、及び該A/D変換手段のサンプリングクロックを発生させるクロック生成手段を有し、前記クロック生成手段は、前記利用周波数範囲に応じて、前記サンプリングクロックの周波数を変更する。

【0042】

この態様によれば、干渉光を示す信号は、A/D変換手段によりA/D変換される。そして、A/D変換手段のサンプリングクロックは、クロック生成手段によって発生されている。

【0043】

ここで特に、クロック生成手段は、サンプリングクロックの周波数を変更可能に構成されている。具体的には、クロック生成手段は、決定される利用周波数範囲に応じてサンプリングクロックの周波数を変更する。例えば、流体が低流速である場合には、利用周波数範囲が比較的狭いものとして決定され、それに応じてサンプリングクロックの周波数は低く設定される。逆に、流体が高流速である場合には、利用周波数範囲が比較的広いものとして決定され、それに応じてサンプリングクロックの周波数は高く設定される。

30

【0044】

上述したようにサンプリングクロックの周波数を適宜変更すれば、例えば低流速時において、FFTのポイント数を増加させることなく周波数分解能を高くできる。また、高流速時において、好適に演算可能な周波数帯域を広げることができる。なお、低流速時に、FFTポイント数を増加させて周波数分解能を高くし、高流速時は、FFTポイント数を減少させて、処理時間の飽和を避けることも可能である。

40

【0045】

本実施形態に係る流速検出装置の他の態様では、前記受光手段は、複数の受光素子を含んで構成されており、該複数の受光素子の各々の検出電流を減算して前記干渉光を示す信号として出力する。

【0046】

この態様によれば、干渉光は受光手段における複数の受光素子の各々で受光される。そして、複数の受光素子の各々における検出電流は、互いに減算処理されて干渉光を示す信号（具体的には、干渉光の強度を示す信号）として出力される。このように複数の受光素子による差動検出を用いれば、干渉光を示す信号のS/N比を向上させることができる。

50

【0047】

本実施形態に係る流速検出装置の他の態様では、前記流路は、交換可能な透明チューブである。

【0048】

この態様によれば、流路が交換可能な透明チューブとして構成されており、適宜他の透明チューブと交換しながら利用される。なお、ここでの「透明」とは、照射される光を完全に透過させるようなものでなくともよく、内部を流れる流体での散乱光を検出できる程度の透明度が実現されていればよい。

【0049】

透明チューブを交換して計測を行う場合、透明チューブの製品バラツキ等に起因して計測条件が変化するため、例えば光学系の焦点位置に高い精度が求められる計測方法を利用する場合には、計測の安定性確保が困難となる。また、このような場合に安定性を確保するには、例えば専用の光学設計がなされた容器をチューブでつなぐ等の工夫が必要であり、装置コストが増大してしまう。

【0050】

しかしながら本態様では、流路での散乱光と流体での散乱光との干渉光を利用する計測方法（即ち、LDF法:Laser Doppler Flowmetry）を採用しているため、上述した計測方法と比べると光学的なバラツキの許容度が高い。従って、計測安定性の確保に高価な部材を使用せずともよく、結果としてコストの増大を抑制することができる。

【0051】

本実施形態に係る第1の流速検出方法は、流路及び該流路を流れる流体に計測光を照射する照射工程と、前記流路によって散乱された前記計測光と、前記流体によって散乱された前記計測光との干渉光を受光する受光工程と、前記流体の速度に関する情報の指定値を取得する取得工程と、前記指定値に基づいて、前記干渉光を示す信号の利用周波数範囲を決定する決定工程と、前記干渉光を示す信号の前記利用周波数範囲を演算して、前記流体の速度に関する情報を出力する出力工程とを含む。

【0052】

本実施形態に係る第1の流速検出方法によれば、上述した本実施形態に係る第1の流速検出装置と同様に、ノイズの影響を考慮した適切な周波数範囲を利用して、流体の速度に関する情報を演算できる。従って、高い精度で流体の速度に関する情報を検出することが可能である。

【0053】

なお、本実施形態に係る第1の流速検出方法においても、上述した本実施形態に係る第1の流速検出装置における各種態様と同様の各種態様を採ることが可能である。

【0054】

本実施形態に係る第2の流速検出方法は、流路及び該流路を流れる流体に計測光を照射する照射工程と、前記流路によって散乱された前記計測光と、前記流体によって散乱された前記計測光との干渉光を受光する受光工程と、前記干渉光を示す信号のスペクトルの傾きが、所定の閾値となる周波数までを、前記干渉光を示す信号の利用周波数範囲として決定する第2の決定工程と、前記干渉光を示す信号の前記利用周波数範囲を演算して、前記流体の速度に関する情報を出力する出力工程とを含む。

本実施形態に係る第2の流速検出方法によれば、上述した本実施形態に係る第2の流速検出装置と同様に、ノイズの影響を考慮した適切な周波数範囲を利用して、流体の速度に関する情報を演算できる。従って、高い精度で流体の速度に関する情報を検出することが可能である。

【0055】

なお、本実施形態に係る第2の流速検出方法においても、上述した本実施形態に係る第2の流速検出装置における各種態様と同様の各種態様を採ることが可能である。

【0056】

本実施形態に係る流速検出装置及び流速検出方法の作用及び他の利得については、以下

に示す実施例において、より詳細に説明する。

【実施例】

【0057】

以下では、図面を参照して流速検出装置及び流速検出方法の実施例について詳細に説明する。

【0058】

＜第1実施例＞

第1実施例に係る流速検出装置について、図1から図5を参照して説明する。

【0059】

＜全体構成＞

10
先ず、第1実施例に係る流速検出装置の全体構成について、図1を参照して説明する。ここに図1は、第1実施例に係る流速検出装置の全体構成を示すブロック図である。

【0060】

図1において、本実施例に係る流速検出装置は、レーザ駆動部110と、半導体レーザ120と、受光素子130と、増幅器140と、信号処理部150と、CPU160と、表示部170と、ポンプ180とを備えて構成されている。

【0061】

レーザ駆動部110は、半導体レーザ120を駆動するための電流を発生する。

【0062】

20
半導体レーザ120は、「照射手段」の一具体例であり、レーザ駆動部110において発生された駆動電流に応じたレーザ光を、計測対象である流体200が流れる透明チューブ250に対して照射する。

【0063】

受光素子130は、「受光手段」の一具体例であり、例えば半導体レーザ120に対して透明チューブ250を挟み込んだ位置に配置されている。受光素子130は、半導体レーザ120から照射されたレーザ光のうち、流体200で散乱された光及び透明チューブ250で散乱された光の干渉光を受光する。

【0064】

増幅器140は、受光素子130で検出された検出電流を電圧に変換して、光強度信号として出力する。

【0065】

30
信号処理部150は、「出力手段」の一具体例であり、光強度信号から流体200の流速を演算して出力する。信号処理部150の具体的な構成及び動作は、後に詳述する。

【0066】

CPU (Central Processing Unit) 160は、装置全体の制御を統括するコントローラとして構成されており、装置を構成する各部位に対して各種指令を出力可能とされている。なお、本実施例に係るCPU160には特に、流体200の速度を指定するための流速指令が外部から入力される。即ち、CPU160は、「取得手段」の一具体例として機能する。流速指令を取得したCPU160は、ポンプ180に対して流速指令に応じた回転指令を出力する。この流速指令は、ポンプ180への回転指令だけでなく、後述する流40
速の演算にも利用される。

【0067】

表示部170は、例えば液晶モニタ等のディスプレイとして構成されており、CPU160からの指令に応じて、演算された流速を表示する。

【0068】

ポンプ180は、例えば、透明チューブ250の弾力性を利用し、モータとギアから構成される回転軸に付随したポンプヘッドのローラ回転作用により連続定期的に流体を定量移送するチュービングポンプとして構成される。

【0069】

＜受光素子の構成＞

次に、第1実施例に係る受光素子130の構成について、図2を参照して説明する。ここに図2は、第1実施例に係る受光素子及び増幅器の構成を示すブロック図である。

【0070】

図2において、本実施例に係る受光素子130は、第1受光素子131及び第2受光素子132の2つの受光素子を備えて構成されている。そして特に、第1受光素子131及び第2受光素子132は、増幅器140における電流電圧変換器141に対して逆極性で接続されている。電流電圧変換器141からの出力は、減算部142において減算処理され、光強度信号として出力される。

【0071】

上述した構成によれば、各受光素子が受光した各光信号のうち、互いに相関が低いもの（例えば、振幅や位相が異なっている信号成分）については、検出電流が増幅されて出力される。一方で、互いに相関が強いもの（例えば、振幅や位相が一致している信号成分）については、それぞれの検出電流が相殺され、各受光素子からの検出電流が抑圧される。その結果、増幅器140から出力される光強度信号は、各受光素子が受光した各光信号のうち無相関成分を増幅した信号であって、相互相関の強い信号成分（例えば、DC光等）を抑圧した信号となる。即ち、本実施例に係る受光素子130及び増幅器140は、無相関信号検出器を構成していると言える。

【0072】

第1受光素子131及び第2受光素子132に入射された光の経路は、第1受光素子131及び第2受光素子132が異なる位置に配置されているので、光波長のオーダーでは、同一経路の光は存在しないと言える。一方、移動体（即ち、流体200）からのドップラシフト光、及び固定物（例えば、透明チューブ250）からの反射光の干渉により生じる光ビート信号は、光の干渉を利用しているので、第1受光素子131及び第2受光素子132が検出した光信号成分である光ビート信号は、互いに無相関な信号と言える。その理由は、ビート信号を生じさせる光の経路が、光波長のオーダーで一致する確率が極めて低いことによる。この結果、第1受光素子131及び第2受光素子132の逆極性接続による減算により、DC成分は抑圧され、信号成分であるビート信号は $\sqrt{2}$ 倍になる。

【0073】

図2において、第1受光素子131及び第2受光素子132の受光面積を等しくし、DC光成分が互いに均等に照射される構成とすると、DC光成分は互いに相殺され出力されない。従って、DC成分による増幅器140の飽和を回避できると共に、信号成分であるAC成分を効率よく増幅できる。具体的には、電流電圧変換抵抗 R_{f1} と R_{f2} の抵抗値を大きく設計できるので、変換感度向上による高S/N化が可能となる。更に、第1受光素子131及び第2受光素子132を同一シリコン上に構成する所謂分割ディテクタの場合、温度変化による特性変化、例えば増幅器140の入力オフセット電圧の増加による暗電流の変化は同相性ノイズとなり、DC光成分と同様に互いに相殺され出力されない。

【0074】

また、入力光量の源となる光源、例えばレーザ光に含まれるノイズ成分は、DC光と同様に同相成分である。例えば、半導体レーザのモードホップノイズによる入力光量のゆらぎは、第1受光素子131及び第2受光素子132に対して同一時刻で発生し、同相性のノイズである。そして、それぞれの検出電流 I_{d1} と I_{d2} におけるモードホップノイズに起因する検出電流のゆらぎ成分は互いに強い相関を持つ。従って、同相成分は互いに相殺されるので、光源のゆらぎに起因するノイズは抑圧され、信号検出におけるS/N比が向上するので好ましい。

【0075】

以上のように、本実施例は光学的感度の低い特別な光学系を使用しないLDF法であっても、ビート信号をS/N良く検出することが可能となる。

【0076】

<信号処理部の構成>

次に、第1実施例に係る信号処理部150の具体的な構成について、図3を参照して説

10

20

30

40

50

明する。ここに図3は、第1実施例に係る信号処理部の構成を示すブロック図である。

【0077】

図3において、第1実施例に係る信号処理部150は、可変増幅器310と、BPF (Band-pass filter) 320と、A/D変換器330と、FFT部340と、演算器350とを備えて構成されている。

【0078】

可変増幅器310は、増幅器140から入力された光強度信号を、CPU160が指令したゲイン調整値に従い増幅し増幅信号として出力する。増幅信号は、BPF320に出力される。

【0079】

BPF320は、「フィルタ手段」の一具体例であり、入力された増幅信号におけるノイズ成分である高域成分や低域成分を除去し、BPF信号として出力する。BPF信号は、A/D変換器330に夫々出力される。

【0080】

A/D変換器330は、「A/D変換手段」の一具体例であり、アナログ信号であるBPF信号をデジタル化し、A/DデータとしてFFT部340に出力する。

【0081】

FFT部340は、「FFT手段」の一具体例であり、高速フーリエ変換によりA/Dデータを周波数解析し、解析結果をスペクトルデータとして演算器350に出力する。

【0082】

演算器350は、CPUから入力される計測帯域指令に応じてスペクトルデータの演算範囲を定め、演算範囲に従い流体200の速度を演算する。演算器350による演算結果は、流速検出値としてCPU160に出力される。

【0083】

<適正計測帯域>

ここで、流速演算の際に考慮される計測帯域について、既出の図1に加え図4を参照して説明する。ここに図4は、低流速時及び高流速時における光強度信号のパワーと周波数との関係を示すグラフ(その1)である。

【0084】

図1において、透明チューブ250の外壁は固定され移動しない。一方、透明チューブ250内を流れる流体200中の散乱体は、ポンプ作用により移動しており流速を有している。そして、半導体レーザ120から出射されたレーザ光の一部は、移動する散乱体により散乱され、ドップラシフトを生じた散乱光となり受光素子130に入射する(実線)。一方、半導体レーザ120から出射されたレーザ光の他の一部は、固定部である透明チューブ250の外壁部で反射し、受光素子130に入射する(点線)。これら両光線は、互いに干渉し、光ビート信号となり受光素子130に入射する。光ビート信号のパワースペクトルは、散乱体の移動速度に応じて変化する。

【0085】

具体的には、図4に示すように、移動速度の遅い低流速時の光強度信号のパワースペクトル $P1(f)$ (実線)は、より低い周波数に集中する。一方、移動速度の速い高流速時の光強度信号のパワースペクトル $P2(f)$ (点線)は、より高い周波数に集中する。そして図4では更に、レーザ照射を停止した場合の光強度信号のパワースペクトルを、ノイズスペクトル $N(f)$ として一点鎖線で示している。ノイズの主原因は、電流電圧変換器141(図2参照)が発生するノイズであり、周波数 f が高くなると増加する。その理由は、受光素子130の端子間静電容量や、電流電圧変換器141の入力静電容量により、電流電圧変換器141で発生したノイズが微分されることによる。

【0086】

ここで、光強度信号のパワースペクトルは、図4を見ても分かるように、低周波領域では、 $P1(f) > P2(f)$ となり、高周波領域では、 $P2(f) > P1(f)$ となる。そして、 $P1(f)$ は、低流速時、周波数 $f1$ 以上の領域において、ノイズ成分 $N(f)$

10

20

30

40

50

の影響を強く受ける。具体的には、低流速時のパワースペクトル $P_1(f)$ は、低周波領域にパワーが集中しており、本来ならば、 f_1 以上の高周波領域では、そのパワーは次第に減少するはずである。一方、ノイズ $N(f)$ は f_1 以上の高周波領域でそのパワーが大きい。この結果、 f_1 以上の高周波領域では、本来の特性ではなく、ノイズ $N(f)$ の特性が $P_1(f)$ の特性を支配することになる。

【0087】

ノイズ $N(f)$ が特性を支配している周波数領域を流速演算に用いると、計測誤差が増大する。その理由は、本来の信号特性と異なり、主にノイズスペクトルを計測に用いてしまうことによる。

【0088】

他方、 $P_2(f)$ は、高流速時、周波数 f_2 以上の領域において、ノイズ成分 $N(f)$ の影響を強く受けるが、周波数 f_1 では、低流速時と異なりノイズ $N(f)$ の影響は小さい。その理由は、高流速時光強度信号のパワーが、低流速時に比較すると高い周波数に集中しているためである。よって、周波数 $f_1 (< f_2)$ では、 $P_2(f)$ の信号パワーはノイズ $N(f)$ のパワーに比較して十分にレベルがあり、ノイズ $N(f)$ に支配されることはない。

【0089】

以上の結果、低流速時の適正計測帯域は f_1 までの帯域であり、 f_1 以上の周波数領域は、流速演算に用いないほうがよいことが分かる。同様に、高流速時の適正計測帯域は f_2 までの帯域であり、 f_2 以上の周波数領域は、流速演算に用いないほうがよい。ただし、低流速時とは異なり、 $f_1 \sim f_2$ の周波数領域は流速演算に用いるほうがよい。仮に、高流速時に、低流速時と同様に f_1 以上の周波数領域を流速演算に用いない場合、本来の信号成分までも部分的に削除することになり、計測誤差が増大してしまうからである。

【0090】

以上のように、低流速時及び高流速時は、適正計測帯域が互いに異なる帯域になる。具体的には、低流速時の適正計測帯域上限 f_1 は、高流速時の適正計測帯域上限 f_2 と比較して低い周波数となる。

【0091】

なお、本実施例では適正計測帯域を高流速時及び低流速時の2段階で設定しているが、2段階に限定される訳ではない。具体的には、高流速時、中流速時、低流速時の3段階で適正計測帯域を設定してもよいし、それ以上の段階に分けて適正計測帯域を設定してもよい。

【0092】

<流速演算処理> 次に、第1実施例に係る流速検出装置による流速演算処理について、図5を参照して説明する。ここに図5は、第1実施例に係る信号処理部の動作を示すフローチャートである。

【0093】

図5において、流速演算処理を実行する信号処理部150では、まずA/D変換器330においてA/Dデータが更新されたか否かが判定される(ステップS101)。そして、A/Dデータが更新されたと判定された場合(ステップS101: YES)、A/Dデータの取り込みが実行される(ステップS102)。

【0094】

A/Dデータが取得されると、FFT部340では、 n ポイントのA/Dデータを用いてFFTが行われ、 $n/2$ ポイントのパワースペクトル $P(n/2)$ が得られる(ステップS103)。スペクトルデータが得られると、CPU160からの計測帯域指令値が確認される。具体的には、計測帯域が広帯域であるか否かが判定される(ステップS104)。

【0095】

なお、計測帯域は、図4を用いて説明したように、低流速時には周波数 f_1 までの帯域、高流速時には周波数 f_2 までの帯域として設定される。なお、本実施例に係るCPU1

10

20

30

40

50

60は特に、入力される流速指令に応じて計測帯域を決定する。

【0096】

ここで、計測帯域が広帯域でない（即ち、狭帯域である）と判定されると（ステップS104：NO）、 n_1 が演算範囲上限を示す n_k として設定される（ステップS105）。一方、計測帯域が広帯域であると判定されると（ステップS104：YES）、 n_2 が n_k として設定される（ステップS106）。なお、ここでの“ n_1 ”及び“ n_2 ”は、それぞれ“ f_1 ”及び“ f_2 ”に対応する値であり、 $n_1 < n_2 \leq n/2$ の関係がある。また、 f_1 及び f_2 についても、 $f_1 < f_2 \leq f_s/2$ の関係が成立している。 n_1 及び n_2 は、具体的には、以下に示す数式（1）及び（2）を満たす数として選択される。

【0097】

$$n_1 = n \cdot f_1 / f_s \quad \dots (1)$$

$$n_2 = n \cdot f_2 / f_s \quad \dots (2)$$

ちなみに、ここでの“ f_s ”は、A/D変換器330のサンプリング周波数である。

【0098】

n_k が設定されると、 $k = 1 \sim n_k$ の範囲で、パワースペクトル $P(n/2)$ の重心位置を示す平均周波数 f_m が演算される（ステップS107）。平均周波数 f_m は、以下の数式（3）により求めることができる。

【0099】

$$f_m = \sum k \cdot P(k) / \sum P(k) \quad \dots (3)$$

続いて、平均周波数 f_m に流速換算係数が乗算され、流速が求められる（ステップS108）。流速が求められると、流速値が表示部170に対応した信号に変換され出力される（ステップS109）。これにより、流速検出装置における一連の処理が終了する。

【0100】

以上説明したように、本実施例に係る流速検出装置によれば、流速指令に基づいて適正計測帯域が決定され、適正計測帯域に応じた演算範囲での演算により流速が演算される。これにより、ノイズの影響を考慮した適切な周波数範囲で流体の速度が演算されるため、高い精度で流速を検出することができる。

【0101】

なお、本実施例に係る流速検出装置は、流速だけでなく流速から求められる他のパラメータ（例えば、流量等）を検出可能に構成されてもよい。

【0102】

<第2実施例>

次に、第2実施例に係る流速検出装置について、図6から図8を参照して説明する。なお、第2実施例は、上述した第1実施例と比べて一部の構成及び動作が異なるのみで、多くの部分は第1実施例と同様である。このため、以下では第1実施例と異なる部分について詳細に説明し、重複する部分については適宜説明を省略するものとする。

【0103】

<信号処理部の構成>

まず、第2実施例に係る信号処理部の構成について、図6を参照して説明する。ここに図6は、第2実施例に係る信号処理部の構成を示すブロック図である。

【0104】

図6において、第2実施例に係る信号処理部150は、可変増幅器310と、第1BPF321と、第2BPF322と、選択部323と、A/D変換器330と、FFT部340と、演算器350と、クロック生成部360とを備えて構成されている。即ち、第2実施例に係る信号処理部150は、第1実施例に係る信号処理部150（図3参照）のBPF320に代えて、第1BPF321、第2BPF322、及び選択部323を備えている。加えて、クロック生成部360を備えている。

【0105】

第1BPF321及び第2BPF322は、可変増幅器310から入力された増幅信号におけるノイズ成分である高域成分や低域成分を除去し、BPF信号として出力する。た

10

20

30

40

50

だし、第1 B P F 3 2 1 及び第2 B P F 3 2 2 は、互いに異なる通過帯域を有するものとして設定されている。

【0106】

選択部323は、第1 B P F 3 2 1 及び第2 B P F 3 2 2 から入力された2つのB P F 信号のうち、いずれか一方を選択的に出力する。なお、いずれのB P F 信号を出力するかは、C P U 1 6 0 から入力される計測帯域指令によって決定される。言い換えれば、いずれのB P F 信号が出力されるかは、流速指令に基づいて決定される。

【0107】

クロック生成部360は、「クロック生成手段」の一例であり、A/D変換器330のサンプリングクロックを、C P U 1 6 0 から入力される計測帯域指令に応じて変更する。即ち、クロック生成部360は、流速指令に応じたサンプリングクロックを生成可能に構成されている。

【0108】

<流速演算時の動作>

次に、第2実施例に係る流速検出装置の流速演算時の動作について、図7及び図8を参照して説明する。ここに、図7は、低流速時及び高流速時における光強度信号のパワーと周波数との関係を示すグラフ（その2）である。また図8は、第1 B P F 及び第2 B P F のゲインと周波数との関係を示すグラフである。

【0109】

図7において、低流速時の光強度信号のパワースペクトルは、流速の増加により、P 1 L (f) からP 1 H (f) へと変化する。このため、図からも導き出せるように、低流速時の適正計測帯域の上限はf 1 となる。同様に、高流速時の光強度信号のパワースペクトルは、流速の増加により、P 2 L (f) からP 2 H (f) へと変化する。よって、高流速時の適正計測帯域の上限はf 2 となる。

【0110】

図8において、第1 B P F 3 2 1 のゲイン特性は、周波数f 1 までの帯域において大きくなるように設定されている。即ち、周波数f 1 を上限とする通過帯域が設定されている。このため、適正計測帯域の上限がf 1 となる低流速時には、選択部323は、第1 B P F 3 2 1 から出力されるB P F 信号を選択すればよい。

【0111】

一方で、第2 B P F 3 2 2 のゲイン特性は、周波数f 2 までの帯域において大きくなるように設定されている。即ち、周波数f 2 を上限とする通過帯域が設定されている。このため、適正計測帯域の上限がf 2 となる高流速時には、選択部323は、第2 B P F 3 2 2 から出力されるB P F 信号を選択すればよい。

【0112】

上述した構成によれば、A/D変換前のB P F 特性が、C P U 1 6 0 からの計測帯域指令に対して変更されるため、A/D変換前の信号帯域が計測すべき流速に対応して最適化される。従って、S/N比が向上し、流速の計測精度が向上する。

【0113】

更に本実施例では、計測すべき帯域が狭い低流速時には、A/D変換のサンプリング周波数を低く設定すべく、クロック生成部360は、基準クロック（図示せず）の分周比を大きく設定する。逆に、高流速時は、計測すべき帯域が広いので、A/D変換のサンプリング周波数を高く設定すべく、クロック生成部は基準クロックの分周比を小さく設定する。

【0114】

このように、計測帯域に応じてA/D変換のサンプリング周波数を変更すれば、低流速時にF F T のポイント数を増加させることなく、周波数分解能を高くでき、より正確な計測が可能となる。また、高流速時は、サンプリング周波数を高く設定できるので、計測帯域を広げることができ、より正確な計測が可能となる。なお、低流速時にF F T ポイント数を増加させて周波数分解能を高くし、高流速時にはF F T ポイント数を減少させて処理

10

20

30

40

50

時間の飽和を避けることも可能となる。

【0115】

以上説明したように、第2実施例に係る流速検出装置によれば、第1実施例と同様に、ノイズの影響を考慮した適切な周波数範囲で流体の速度が演算されるため、高い精度で流速を検出することができる。

【0116】

<第3実施例>

次に、第3実施例に係る流速検出装置について、図9を参照して説明する。なお、第3実施例は、上述した第1及び第2実施例と比べて一部の構成及び動作が異なるのみで、多くの部分は第1及び第2実施例と同様である。このため、以下では第1及び第2実施例と異なる部分について詳細に説明し、重複する部分については適宜説明を省略するものとする。

【0117】

<全体構成>

先ず、第3実施例に係る流速検出装置の全体構成について、図9を参照して説明する。ここに図9は、第3実施例に係る流速検出装置の全体構成を示すブロック図である。

【0118】

図9において、第3実施例に係る流速検出装置は、レーザ駆動部110と、半導体レーザ120と、受光素子130と、増幅器140と、信号処理部150と、CPU160と、表示部170と、ポンプ180と、回転数検出部191と、回転制御部192とを備えて構成されている。即ち、第3実施例に係る流速検出装置は、第1実施例に係る流速検出装置（図1参照）に加えて、回転数検出部191及び回転制御部192を備えている。

【0119】

回転数検出部191は、「回転数検出手段」の一具体例であり、ポンプ180の回転数を検出し、回転制御部192及びCPU160に夫々出力する。

【0120】

回転制御部181は、外部からの流速指令に対応するリファレンス回転数と回転数検出部182が検出した回転数とを比較して、ポンプ180に対して駆動量を負帰還することにより、ポンプ180の回転数を制御する。

【0121】

<流速演算時の動作>

次に、第3実施例に係る流速検出装置の流速演算時の動作について、引き続き図9を参照して説明する。

【0122】

流速演算時において、第3実施例に係る流速検出装置のCPU160では、回転数検出部191が検出したポンプの回転数に応じて計測帯域が設定され、信号処理部150に対して計測帯域指令が送出される。具体的には、検出されたポンプ180の回転数から流体200の速度が推定され、推定された流速値に基づいて計測帯域が設定される。即ち、第3実施例では、第1及び第2実施例のように流速指令に基づいて直接的に計測帯域が設定されるのではなく、ポンプ180の実際の駆動量から求められる流速の推定値に基づいて計測帯域が設定される。

【0123】

上述したように計測帯域を設定すれば、第1実施例及び第2実施例のように流速指令に基づいて計測帯域を設定する場合と比べて、より適切な計測帯域を設定できる。具体的には、実際にポンプ180において実現されている駆動量に応じて流速が推定されるため、例えば流速指令と実際の駆動量とに差が生じている場合であっても、好適に計測帯域を決定できる。

【0124】

以上説明したように、第3実施例に係る流速検出装置によれば、流体200を流す駆動手段の駆動量に応じて計測帯域が決定されるため、より適切な周波数範囲で流速が演算さ

10

20

30

40

50

れる。従って、高い精度で流速を検出することができる。

【0125】

<第4実施例>

次に、第4実施例に係る流速検出装置について、図10及び図11を参照して説明する。なお、第4実施例は、上述した第1から第3実施例と比べて一部の構成が異なるのみで、多くの部分は第1から第3実施例と同様である。このため、以下では第1から第3実施例と異なる部分について詳細に説明し、重複する部分については適宜説明を省略するものとする。

【0126】

<流速演算処理>

図10において、第4実施例に係る流速検出装置では、 n ポイントのFFT処理により、 $n/2$ ポイントのパワースペクトル $P(n/2)$ が求められる点までは、第1実施例における図5で示した処理（即ち、ステップS101～S103）と同様の処理が行われる（ステップS201）。

【0127】

パワースペクトル $P(n/2)$ が求められると、複数回のFFT処理により平均的なパワースペクトル $P_a(n/2)$ が求められる（ステップS202）。

【0128】

続いて、周波数の最大値 $n/2$ がポインタ m として初期化される（ステップS203）。そして、 $P_a(m-1) - P_a(m)$ が演算され、基準値 Δ より大きいかが判断される（ステップS204）。ここで、 $P_a(m-1) - P_a(m)$ が基準値 Δ より大きい場合（ステップS204：YES）、ポインタ m が n_k に格納される（ステップS205）。即ち、現在のポインタ m が計測帯域の上限値に対応する値として決定される。一方で、 $P_a(m-1) - P_a(m)$ が基準値 Δ より大きくない場合（ステップS204：NO）、ポインタ $m-1$ がポインタ m として再設定され（ステップS206）、再びステップS204の処理が実行される。即ち、ステップS204の処理は、 $P_a(m-1) - P_a(m)$ が基準値 Δ より大きくなるまで繰り返し実行される。

【0129】

図11において、 $P_a(m-1) - P_a(m)$ は、光強度信号のパワースペクトルの傾きに対応している。そして、図を見ても分かるように、パワースペクトルの傾きはノイズ影響率に対応しており、パワースペクトルの傾きが一定の値より大きければ、ノイズの影響は小さいと考えることができる。基準値 Δ は、このようにノイズの影響率を判断するために設定された閾値であり、パワースペクトルの傾き $P_a(m-1) - P_a(m)$ と、基準値 Δ とを互いに比較することで、ノイズの影響が十分に小さいか否か（即ち、流速の演算に用いるべきか否か）を判別することが可能となる。

【0130】

図11の例では、比較的流速が低い場合のパワースペクトル $P_1(f)$ の傾きが Δ より大きくなる周波数 f_{1a} が演算範囲の上限値として決定されている。同様に、比較的流速が速い場合のパワースペクトル $P_2(f)$ の傾きが Δ より大きくなる周波数 f_{2a} が演算範囲の上限値として決定されている。このように第4実施例では、第1実施例における流速指令或いは第3実施例におけるポンプ180の回転数のようなパラメータを取得しなくとも、内部処理によって計測帯域を決定することができる。

【0131】

図10に戻り、 n_k の格納が終了すると、第1実施例（即ち、図5のステップS107）と同様に平均周波数 f_m が演算される（ステップS207）。ただし、第4実施例では、平均化されたパワースペクトル $P_a(k)$ を演算に用いている点が他の実施例と異なっている。具体的には、平均周波数 f_m は、以下の数式（4）により求められる。

【0132】

$$f_m = \sum k \cdot P_a(k) / \sum P_a(k) \quad \cdots (4)$$

平均周波数 f_m が演算されると、流速換算処理が実行される（ステップS208）。こ

10

20

30

40

50

の流速換算処理についても、第1実施例（即ち、図5のステップS108）と概ね同様であるが、第4実施例では、周波数範囲 n_k の値に応じて換算係数が補正される。具体的には、周波数範囲 n_k の値が大きい場合、流速が高いと判断し、高い流速に対応した換算係数が用いられる。同様に、周波数範囲 n_k の値が小さい場合、流速が低いと判断し、低い流速に対応した換算係数が用いられる。より具体的には、周波数範囲 n_k をテーブルアドレスとした換算係数テーブルが読み出され、平均周波数 f_m から流速を得るための換算係数を得て、流速換算処理が実行される。なお、換算係数テーブルは、あらかじめ実験等により校正しておけばよい。

【0133】

流速が求められると、流速値が表示部170に対応した信号に変換され出力される（ステップS209）。これにより、流速検出装置の一連の処理が終了する。

10

【0134】

以上説明したように、第4実施例に係る流速検出装置によれば、平均パワースペクトル P_a の傾きを検出して、自動的に流速演算に用いる周波数範囲を限定できるため、広い流速範囲において安定した流速計測が実施できる。

【0135】

本発明は、上述した実施形態に限られるものではなく、特許請求の範囲及び明細書全体から読み取れる発明の要旨或いは思想に反しない範囲で適宜変更可能であり、そのような変更を伴う流速検出装置及び流速検出方法もまた本発明の技術的範囲に含まれるものである。

20

【符号の説明】

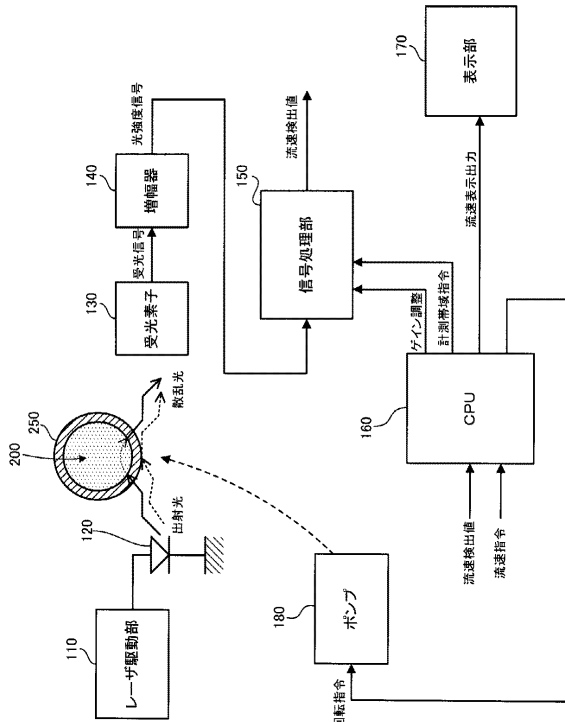
【0136】

- 110 レーザ駆動部
- 120 半導体レーザ
- 130 受光素子
- 131 第1受光素子
- 132 第2受光素子
- 140 増幅器
- 141 電流電圧変換器
- 142 減算部
- 150 信号処理部
- 160 CPU
- 170 表示部
- 180 ポンプ
- 191 回転数検出部
- 192 回転制御部
- 200 流体
- 250 透明チューブ
- 310 可変増幅器
- 320 BPF
- 321 第1BPF
- 322 第2BPF
- 323 選択部
- 330 A/D変換器
- 340 FFT部
- 350 演算器
- 360 クロック生成部

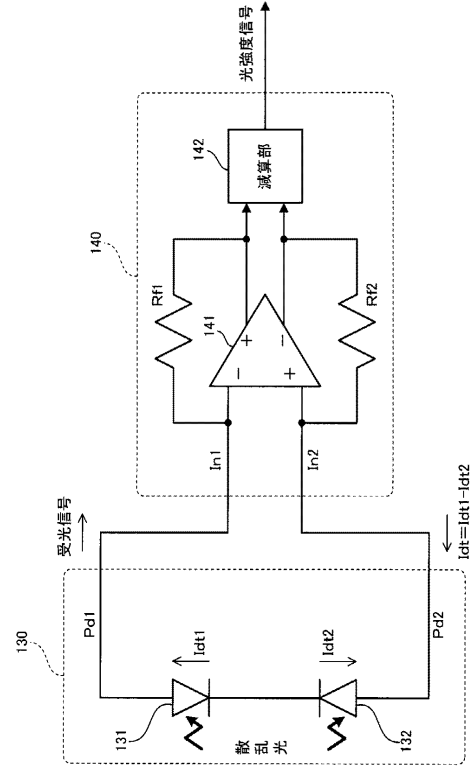
30

40

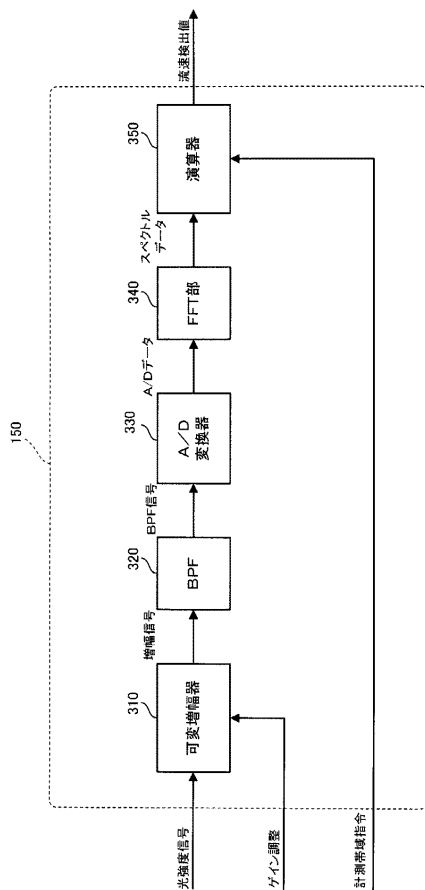
【図 1】



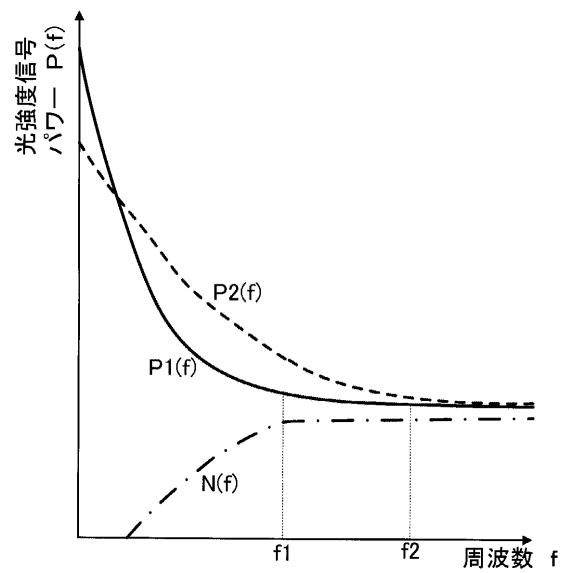
【図 2】



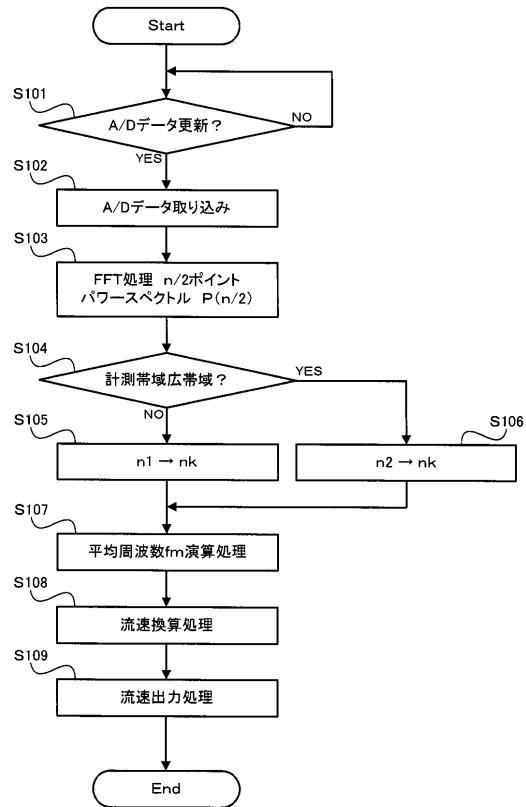
【図 3】



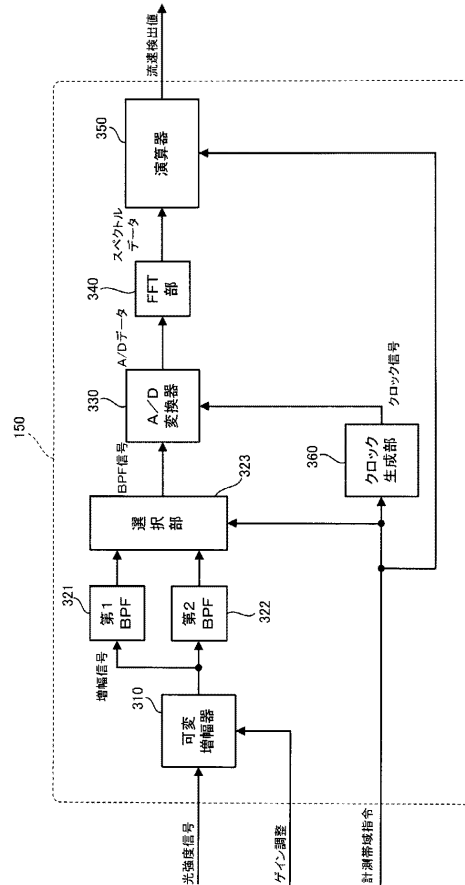
【図 4】



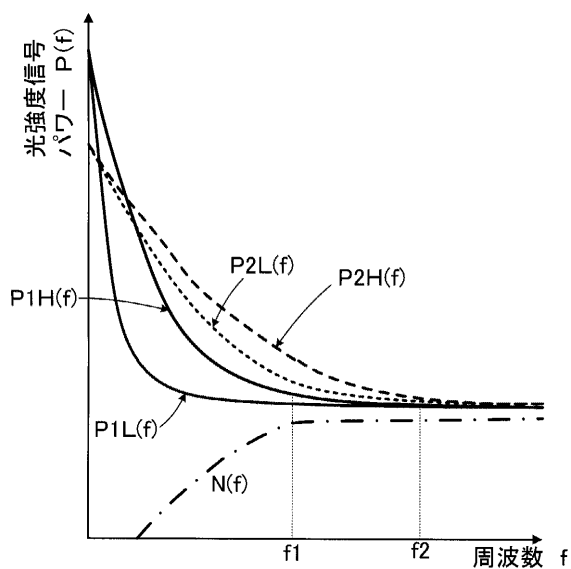
【図 5】



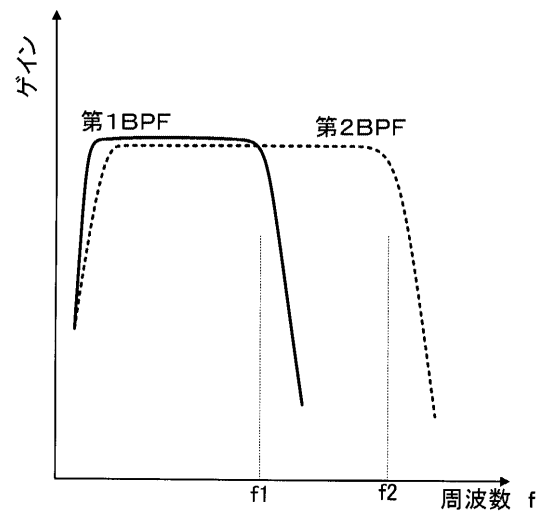
【図 6】



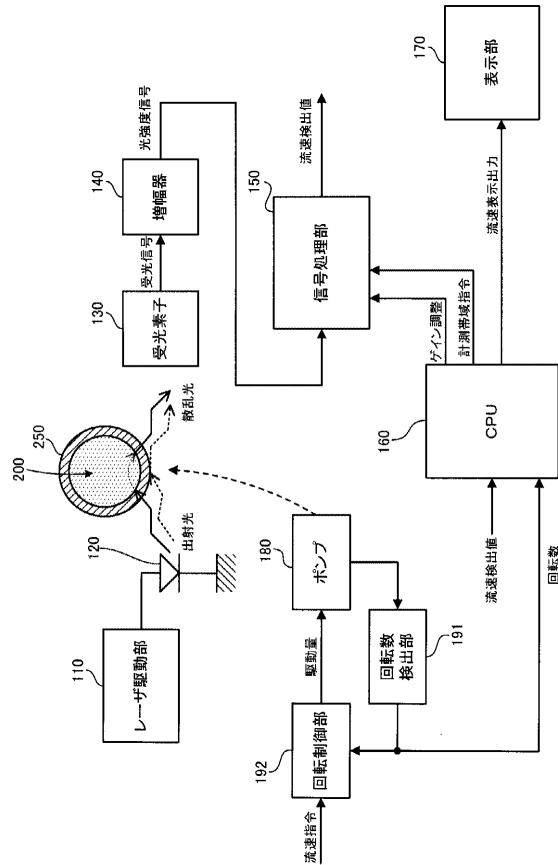
【図 7】



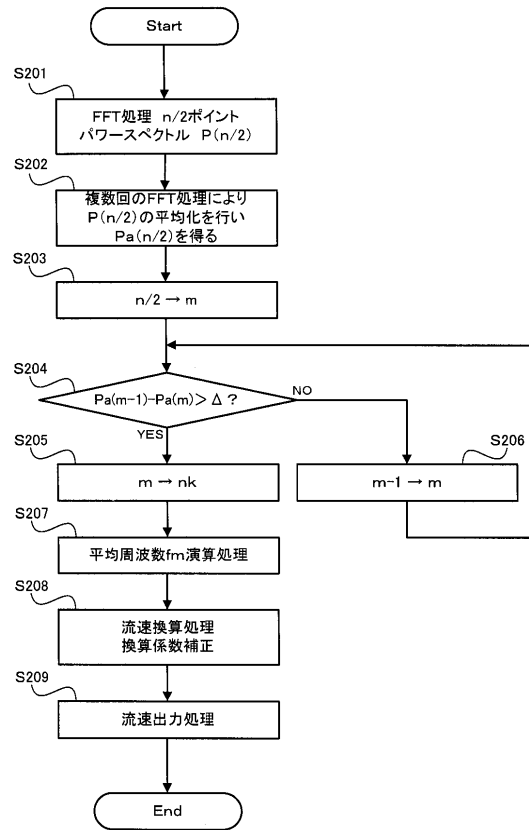
【図 8】



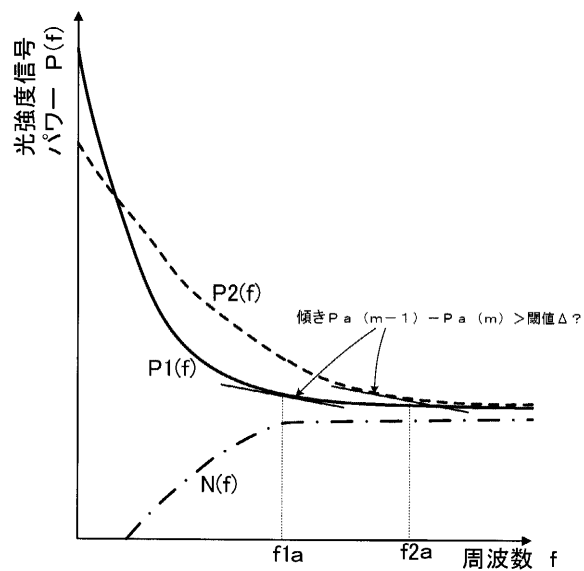
【図 9】



【図 10】



【図 11】



フロントページの続き

- (56)参考文献 特表2012-520720 (JP, A)
特開平3-247325 (JP, A)
特開2009-63570 (JP, A)
特開2009-204321 (JP, A)

- (58)調査した分野(Int.Cl., DB名)
G01F 1/66
G01P 5/26